

II Всероссийская научная
конференция
«Проблемы СВЧ-Электроники»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Инновационные решения

Keysight Technologies



Москва, 26-28 октября
МИЭМ НИУ ВШЭ

Уважаемые коллеги!

Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и компания **Keysight Technologies** приглашает Вас принять участие во II Всероссийской научной конференции «Проблемы СВЧ-электроники», которая состоится 26-28 октября 2015 г в Москве в МИЭМ НИУ ВШЭ по адресу: Таллинская ул., д. 34

В ходе конференции будут обсуждаться наиболее значимые вопросы, возникающие в процессе работы в данной области, тенденции, а также области применения и варианты использования СВЧ-технологий в научных исследованиях и разработках. Ведущие эксперты в области СВЧ познакомят с новейшими научными и технологическими достижениями, актуальными направлениями исследований в области радиотехники, радиофизики, СВЧ-электроники, технологии радиоэлектронного приборостроения, информационных технологий. На конференции будут заслушаны приглашенные обзорные доклады, оригинальные сообщения о новых результатах исследований и разработок в виде устных и стендовых докладов, а также будет проведено специальное заседание, посвященное сравнительному анализу и применению вакуумных и твердотельных приборов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.

Конференцию «Проблемы СВЧ-Электроники» **26 октября** откроет день «**Инновационные решения Keysight Technologies**». Цель данного проекта – обсуждение развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в России и вклад компании Keysight в распространении новейших технологий для решения инженерных проблем, их использование для автоматизации производства ВЧ/СВЧ-устройств; моделирования; повышения эффективности и уровня обучения студентов техническим дисциплинам; привлечение молодых специалистов в область перспективных научных поисков.

В рамках конференции будут представлены развернутые доклады ведущих специалистов компании Keysight Technologies. Эксперты Keysight Technologies проведут технические

презентации и интерактивные мастер-классы, посвященные инновационным достижениям техники и профессиональным решениям Keysight Technologies. Участники конференции смогут услышать о последних тенденциях развития технологий измерительного оборудования и специализированных программных средствах.

Полную программу Конференции «Проблемы СВЧ-Электроники» смотрите на сайте <http://miem.hse.ru/microwave>

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте irk.hse.ru

С уважением,

Организационный комитет конференции